



Caracterización elipsométrica de materiales dieléctricos de aplicación en el desarrollo de sensores evanescentes de fibra óptica para el sector aeroespacial : memoria para optar al grado de doctor /

Álvarez Herrero, Alberto (1971-)

[Universidad Complutense], Servicio de Publicaciones, [2007]

Tesis y escritos académicos

Recurso Electrónico

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbgVicmF0aW9uOmVzLmJhemF0ei5yZW4vMjE1MzU1MDE>

Título: Caracterización elipsométrica de materiales dieléctricos de aplicación en el desarrollo de sensores evanescentes de fibra óptica para el sector aeroespacial memoria para optar al grado de doctor presentada por Alberto Álvarez Herrero ; bajo la dirección de los doctores Héctor Guerrero Padrón, David Levy Cohén

Editorial: Madrid [Universidad Complutense], Servicio de Publicaciones [2007]

Descripción física: 1 disco (CD-ROM) 12 cm

Mención de serie: Tesis doctorales. Ciencias exactas y de la naturaleza

Tesis: Tesis--Universidad Complutense de Madrid, 2002

Bibliografía: Bibliografía

Copyright/Depósito Legal: M 1008-2007 Oficina Depósito Legal Madrid

ISBN: 84-669-1724-1

Punto acceso adicional serie-Título: Tesis doctorales (Universidad Complutense de Madrid. CD-ROM). Ciencias exactas y de la naturaleza

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es